

Microscopies et optique de champ proche

Compétences

- Microscopies en champ proche optique
- Microscopie shear force (ou de cisaillement, équivalent de la microscopie à force atomique ou AFM)
- Caractérisation optique et topographique de surfaces de rugosités de 0,1 nm au micron.
- Nanophotonique, Optique intégrée
- Simulation numérique du champ électromagnétique

Secteurs d'activité

- Optique,
- Photonique
- Métrologie de surface
- Microscopies en champ proche

Atouts/équipements spécifiques

- Trois microscopes en champ proche
- Lasers accordables visible IR
- Source à continuum de fréquences
- Spectroscopes visible IR
- Salle de préparation des surfaces et des sondes de champ proche
- Etireuse à fibres optiques

Applications possibles

- Caractérisation de micro et nano-composants de l'optique intégrée
- Caractérisation de nano-objets individuels
- Caractérisation de surfaces et de leur évolution

Exemples de clients : LNE, CEA, Orange Labs, BNM